



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

АППАРАТЫ РЕНТГЕНОВСКИЕ  
АНАЛИТИЧЕСКИЕ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.198—85

Издание официальное

Цена 10 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ССРП ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**Система показателей качества продукции  
АППАРАТЫ РЕНТГЕНОВСКИЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ**

**Номенклатура показателей**

Product-quality index system. X-ray analytical apparatus. Nomenclature of indices

**ГОСТ  
4.198—85**

ОКСТУ 0004

**Дата введения**

**01.01.87**

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества рентгеновских аналитических аппаратов, включаемых в технические задания на научно-исследовательские работы (ТЗ на НИР) по определению перспектив этой группы, государственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые стандарты на продукцию, технические задания на опытно-конструкторские работы (ТЗ на ОКР), технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ).

Коды рентгеновских аналитических аппаратов, входящих в группу однородной продукции по ОКП:

42 7651 — аппаратура рентгеноструктурная: дифрактометры общего назначения (прецзионные, средней точности, упрощенные), дифрактометры специализированные (текстурные, для исследования монокристаллов, для определения макронапряжений, малоугловые, для исследования в особых условиях — низкотемпературные и высокотемпературные, для исследования реальной структуры кристаллов — на основе детекторов телевизионного типа), аппараты рентгеновские для структурного анализа с фоторегистрацией (с отпаянной рентгеновской трубкой, с вращающимся анодом);

42 7651 — аппаратура рентгеноспектральная: спектрометры кристалл-дифракционные (многоканальные, сканирующие), спектрометры бездифракционные с полупроводниковым детектором, анализаторы рентгеновские;

- 42 7651 — микроскопы рентгеновские: с фоторегистрацией, анализаторы, рентгенотелевизионные;  
 42 7651 — аппараты рентгенолюминесцентные: сепараторы люминесцентные;  
 42 7651 — микроанализаторы рентгеновские;  
 42 7651 — приборы рентгенофизические: аппараты для исследования тонкой структуры рентгеновских спектров;  
 42 7658 — приборы рентгенофизические: спектрометры рентгеноэлектронные, спектрометры оже-электронные.

Алфавитный перечень показателей качества продукции приведен в справочном приложении 1.

Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приведены в справочном приложении 2.

Примеры расчета некоторых показателей качества продукции приведены в справочном приложении 3.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА РЕНТГЕНОВСКИХ АНАЛИТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые ими свойства рентгеновских аналитических аппаратов приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризуемого свойства
1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ		
1.1. Диапазон углового перемещения блока детектирования, град	$2\Theta_h, 2\Theta_k; v_h, v_k, v_{hk}, v_k$	Диапазон регистрации дифрактограмм
1.2. Основная аппаратурная погрешность, (ГОСТ 16865—79), %	$A_0$	Стабильность аналитического сигнала аппарата
1.3. Допускаемое отклонение блока детектирования от заданного угла поворота, град	$\delta_0$	Искажение дифрактограммы
1.4. Диапазон поворота по углу $\alpha$ , ...	—	Аналитические возможности аппарата
1.5. Диапазон рабочих углов, ...°	$2\Theta$	То же
1.6. Сходимость показаний аппарата	—	Стабильность выходного параметра аппарата
1.7. Интервал рабочих температур, при которых исследуется образец, °C	$\tau(\Delta T)$	Диапазон воздействующих факторов
1.8. Номинальная мощность рентгеновской трубки, Вт (кВт)	$W$	Аналитические возможности аппарата
1.9. Угловая установка кристалла ( $\varphi, \chi, \omega$ ), ...°	—	То же
1.10. Диапазон анализируемых элементов	—	Аналитические возможности аппарата

## Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризуемого свойства
1.11. Максимальное количество одновременно анализируемых элементов	—	Аналитические возможности аппарата
1.12. Время одного цикла (ввод пробы, измерение, вывод пробы), с	—	Производительность
1.13. Скорость счета на линии на контрольном образце, $\text{с}^{-1}$	η	Аналитические возможности аппарата
1.14. Спектральное разрешение (волновое, энергетическое), нм, эВ, %	—	Селективность анализа
1.15. Погрешность угловой установки кристалла (по $\phi$ , $\chi$ , $\omega$ ), ...	—	Достоверность анализа
1.16. Разрешение, ...	—	Возможность получения требуемого линейного разрешения
1.17. Увеличение×	—	Линейная разрешающая способность
1.18. Линейное разрешение, мкм	—	Эффективность работы аппарата
1.19. Извлечение минерала, %	—	Производительность
1.20. Производительность на классе крупности, т/ч	—	Качество сортировки
1.21. Выход материала на отсечку (или на 10 отсечек), кг (зерен)	—	Аналитические возможности аппарата
1.22. Диапазон исследуемого излучения, нм, кэВ	—	Стабильность аналитического сигнала
1.22а. Среднее квадратическое отклонение от среднего значения измеряемых деформаций, %	—	То же
1.23. Диапазон ускоряющих напряжений, кВ	—	Наибольшее поле зрения
1.24. Наименьшее увеличение в растровом режиме×	—	Чувствительность прибора
1.25. Отношение сигнал/шум	—	Стабильность аналитического сигнала
1.25а. Погрешность регулирования заданной температуры	—	Аналитические возможности аппарата
1.26. Рабочая площадь входного окна детектора, $\text{мм}^2$	—	Производительность аппарата
1.27—1.27.2. (Исключены, Изм. № 1).	—	Аналитические возможности аппарата
1.28. Минимальный шаг сканирования, нм	—	Производительность аппарата
1.29. Установочная скорость угловых перемещений блока детектирования, ... °/мин	—	Аналитические возможности аппарата
1.30. Диапазон угловых перемещений рентгеновской трубки, ... °	—	Аналитические возможности аппарата
1.31. Допускаемые размеры исследуемого образца, мм	—	—
1.32. Рабочая среда	—	—
1.33. Наименьшее (пределное остаточное) давление в рабочем объеме, Па	—	—

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризуемого свойства
1.34. Диапазон регулировки высокого напряжения и анодного тока, кВ, мА	—	Аналитические возможности аппарата
1.35. Класс крупности обрабатываемого материала, мм	—	Характеристика обогащаемого материала
1.36. Контрастность (ГОСТ 16865—79)	K	
1.37. Предел обнаружения (ГОСТ 16865—79), г, %	—	Аналитические возможности
1.38. Удельная нагрузка на действительное фокусное пятно рентгеновской трубы (ГОСТ 20337—74), Вт/мм <sup>2</sup>	—	Производительность
1.39. Контрастная чувствительность, %	—	Качество изображения
1.40. Осциллирование блока детектирования сцинтилляционного, ...	—	Аналитические возможности аппарата
1.41. Нестабильность анодного напряжения и тока, %	—	То же
1.42. Размеры экрана для визуального наблюдения, мм	—	Удобство наблюдения, обзорность
1.43. Наличие сканирующего канала	—	Аналитические возможности аппарата
1.44. (Изменение, Изм. № 1).	—	
1.45. Автоматическое управление смешанной образцов	—	Способность автоматического управления смешанной образцов
1.46. Наличие автоматизации управления и обработки данных	—	Возможность комплексной работоспособности системы «аппарат—ЭВМ»
1.47. Оснащенность дополнительными устройствами (например наличие приставок)	—	Ускорение анализа
1.48. Воспроизводимость положения линий спектра, эВ	—	
1.49. Габаритные размеры (или установочная площадь), мм (мм <sup>2</sup> )	—	
1.50. Условия эксплуатации	—	
1.50.1. Параметры питающей сети	—	
1.50.2. Устойчивость к климатическим воздействиям	—	
1.50.3. Устойчивость к механическим воздействиям	—	
2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ		
2.1. Показатели безотказности		
2.1.1. Средняя наработка на отказ (ГОСТ 27.002—83), ч (цикл)	T <sub>0</sub>	
2.1.2. Установленная безотказная наработка (РД 50—650—87), ч (цикл)	T <sub>y</sub>	

## Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризуемого свойства
2.2. Показатели долговечности		
2.2.1. Полный средний срок службы (ГОСТ 27.002—83), лет	$T_{\text{сл}}$	
2.2.2. Установленный срок службы (ГОСТ 27.003—83), лет	$T_{\text{сл.у}}$	
2.3. Показатель ремонтопригодности		
2.3.1. Среднее время восстановления работоспособного состояния (ГОСТ 27.003—83), ч	$T_b$	

## 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, ЭНЕРГИИ

3.1. Масса, кг	—	Экономичность расхода материала
3.2. Потребляемая мощность, В·А	—	Экономичность энергопотребления

## 4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Показатель уровня шума	—	
4.2. Показатель уровня освещенности	—	
4.3. Показатель уровня температуры, влажности	—	
4.4. Показатель уровня вибрации	—	
4.5. Уровень радиопомех	—	
4.6. Соответствие изделия силовым, энергетическим возможностям человека	—	
4.7. Соответствие изделия слуховым и зрительным возможностям человека	—	
4.8. Соответствие изделия закрепленным и вновь формируемым навыкам человека	—	
4.9. Возможность восприятия и переработки информации	—	
4.10. Соответствие изделия размерам тела человека и его частей	—	
4.11. Соответствие изделия форме тела человека и его отдельных частей	—	

## 5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5.1. Информационная выразительность	—	
5.1.1. Соответствие современным эстетическим представлениям	—	
5.2. Рациональность формы	—	
5.2.1. Функциональность	—	
5.3. Целостность композиции	—	

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Найменование характеризуемого свойства
5.3.1. Уровень композиционного решения	—	
5.4. Совершенство производственного исполнения (товарный вид)	—	
6. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ (ГОСТ 14.205—83)		
6.1. Трудоемкость изготовления изделия, нормо-ч.	$T_i$	
6.2. Технологическая себестоимость изделия, руб.	$C_t$	
7. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ		
7.1. Температура транспортирования, °C	—	
7.2. Верхнее значение относительной влажности при температуре, %	—	
7.3. Транспортная тряска при частоте ударов в минуту	—	
8. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ		
8.1. Коэффициент применяемости, %	$K_{пр}$	
8.2. Коэффициент повторяемости, %	$K_p$	
9. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
9.1. Показатель патентной защиты	$P_{п.з}$	
9.2. Показатель патентной чистоты	$P_{п.ч}$	
10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ		
10.1. Мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения, А/кг	—	
11. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ		
11.1. Время срабатывания защиты, с	—	
11.2. Электрическая прочность изоляции, кВ	—	
11.3. Электрическое сопротивление изоляции, Ом	—	
11.4. Наличие блокирующих устройств	—	
11.5. Наличие аварийных сигнализаций, световой индикации	—	

Примечания:

- Основные показатели качества набраны жирным шрифтом.
- Показатель 1.24 считать основным только при отсутствии встроенного светового микроскопа.

1.2. Показатели качества аппаратов, приведенные в табл. 1, могут быть дополнены показателями, которые отражают особенности функционального назначения, области применения и др.

## 2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА РЕНТГЕНОВСКИХ АНАЛИТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

2.1. Перечень основных показателей качества:  
**дифрактометров общего назначения** (прецзионных, средней точности, упрощенных): диапазон углового перемещения блока детектирования, основная аппаратурная погрешность, допускаемое отклонение блока детектирования от заданного угла поворота, установочная скорость угловых перемещений блока детектирования, оснащенность дополнительными устройствами, автоматическое управление сменой образцов, наличие автоматизации управления и обработки данных, установленная безотказная наработка, средняя наработка на отказ, полный средний срок службы, масса, потребляемая мощность;

**дифрактометров специализированных текстурных:** диапазон углового перемещения блока детектирования, основная аппаратурная погрешность, диапазон поворота по углу, наличие автоматизации управления и обработки данных, установленная безотказная наработка, средняя наработка на отказ, полный средний срок службы, масса, потребляемая мощность;

**дифрактометров специализированных для исследования монокристаллов:** диапазон углового перемещения блока детектирования, допускаемое отклонение блока детектирования от заданного угла поворота, угловая установка кристалла, погрешность угловой установки кристалла, наличие автоматизации управления и обработки данных, установленная безотказная наработка, средняя наработка на отказ, полный средний срок службы, масса, потребляемая мощность;

**дифрактометров специализированных для исследования реальной структуры кристаллов (на основе детекторов телевизионного типа):** рабочая площадь входного окна детектора, линейное разрешение, контрастная чувствительность, наличие автоматизации управления и обработки данных, установленная безотказная наработка, средняя наработка на отказ, полный средний срок службы, масса, потребляемая мощность;

**дифрактометров специализированных для определения макронапряжений:** диапазон рабочих углов, среднее квадратическое отклонение от среднего значения измеряемых деформаций, осциллирование блока детектирования сцинтиляционного, наличие автоматизации управления и обработки данных, установленная безотказная наработка, средняя наработка на отказ, полный средний срок службы, масса, потребляемая мощность;

**дифрактометров специализированных малоугловых:** диапазон рабочих углов, разрешение, наличие автоматизации управления и обработки данных, установленная безотказная наработка на отказ, полный средний срок службы, масса, потребляемая мощность;

**дифрактометров специализированных для исследования в особых условиях (низкотемпературных, высокотемпературных):** интервал рабочих температур, при которых исследуется образец, погрешность регулирования заданной температуры, наличие автоматизации управления и обработки данных, наименьшее давление в рабочем объеме, установленная безотказная наработка, средняя наработка на отказ, полный средний срок службы, масса, потребляемая мощность;

**аппаратов рентгеновских для структурного анализа с фотопрегистрацией (с отпаянной рентгеновской трубкой, с вращающимся анодом):** удельная нагрузка на действительное фокусное пятно рентгеновской трубы, нестабильность анодного напряжения и тока, установленная безотказная наработка, средняя наработка на отказ, полный средний срок службы, масса, потребляемая мощность;

**спектрометров кристалл-дифракционных многоканальных:** основная аппаратурная погрешность, диапазон анализируемых элементов, максимальное количество одновременно анализируемых элементов, время одного цикла (ввод пробы, измерение, вывод яробы), скорость счета на линии на контрольном образце, контрастность, наличие сканирующего канала, автоматическое управление сменой образцов, наличие автоматизации управления и обработки данных, установленная безотказная наработка, средняя наработка на отказ, полный средний срок службы, масса, потребляемая мощность;

**спектрометров кристалл-дифракционных сканирующих:** основная аппаратурная погрешность, диапазон анализируемых элементов, скорость счета на линии на контрольном образце, контрастность, автоматическое управление сменой образцов, наличие автоматизации управления и обработки данных, установленная безотказная наработка, средняя наработка на отказ, полный средний срок службы, масса, потребляемая мощность;

**спектрометров бездифракционных с полупроводниковым детектором:** основная аппаратурная погрешность, диапазон анализируемых элементов, скорость счета на линии на контрольном образце, автоматическое управление сменой образцов, наличие автоматизации управления и обработки данных, спектральное разрешение (энергетическое), установленная безотказная наработка, средняя наработка на отказ, полный средний срок службы, масса, потребляемая мощность;

**анализаторов рентгеновских:** основная аппаратурная погрешность, диапазон анализируемых элементов, максимальное количе-

тво одновременно анализируемых элементов, скорость счета на линии на контрольном образце, контрастность, предел обнаружения, автоматическое управление сменой образцов, наличие автоматизации управления и обработки данных, установленная безотказная наработка, средняя наработка на отказ, полный средний срок службы, масса, потребляемая мощность;

**микроскопов рентгеновских (с фоторегистрацией, анализаторов, рентгенотелевизионных):** номинальная мощность рентгеновской трубы, увеличение, линейное разрешение, установленная безотказная наработка, средняя наработка на отказ, полный средний срок службы, масса, потребляемая мощность;

**аппаратов рентгенолюминесцентных:** извлечение минерала, производительность на классе крупности, выход материала на отсечку, класс крупности обрабатываемого материала, наличие автоматизации управления и обработки данных, установленная безотказная наработка, средняя наработка на отказ, полный средний срок службы, масса, потребляемая мощность;

**микроанализаторов рентгеновских:** максимальное количество одновременно анализируемых элементов, скорость счета на линии на контрольном образце, линейное разрешение, диапазон анализируемых элементов, диапазон ускоряющих напряжений, наименьшее увеличение в растровом режиме, наличие автоматизации управления и обработки данных, установленная безотказная наработка, средняя наработка на отказ, полный средний срок службы, масса, потребляемая мощность;

**спектрометров рентгеноэлектронных:** разрешение спектральное (энергетическое), воспроизводимость положения линии спектра, скорость счета на линии на контрольном образце, контрастность, наименьшее давление в рабочем объеме, наличие автоматизации управления и обработки данных, установленная безотказная наработка, средняя наработка на отказ, полный средний срок службы, масса, потребляемая мощность;

**спектрометров оже-электронных:** отношение сигнал/шум, линейное разрешение, спектральное разрешение (энергетическое), наименьшее давление в рабочем объеме, наличие автоматизации управления и обработки данных, установленная безотказная наработка, средняя наработка на отказ, полный средний срок службы, масса, потребляемая мощность;

**аппаратов для исследований тонкой структуры рентгеновских спектров:** диапазон исследуемого излучения, воспроизводимость положения линии спектра, спектральное разрешение (волновое, энергетическое), наименьшее давление в рабочем объеме, наличие автоматизации управления и обработки данных, установленная безотказная наработка, средняя наработка на отказ, полный средний срок службы, масса, потребляемая мощность.

2.2. Применяемость показателей качества по подгруппам однородной продукции для рентгеноструктурной аппаратуры приве-

дена в табл. 2, рентгеноспектральной — в табл. 3, микроскопов рентгеновских, аппаратов рентгенолюминесцентных, микроанализаторов рентгеновских — в табл. 4, приборов рентгенофизических — в табл. 5.

Применимость показателей качества аппаратов рентгеновских аналитических, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития, ГОСТ ОТТ, в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, ТУ, КУ, ТЗ на ОКР, приведена в табл. 6.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 2

Номер показания по табл. 1	Применяемость по подгруппам однородной продукции		Аппараты рентгеновские для структурного анализа с фотогравировкой	
	Дифрактометры общего назначения	Дифрактометры специализированные	для исследования реальной структуры кристаллов на основе детекторов телевизионного типа	с оплавленной с вращающимся анодом
1.1	+++	+++	+++	+++
1.2	+++	+++	+++	+++
1.3	+++	+++	+++	+++
1.4	+++	+++	+++	+++
1.5	+++	+++	+++	+++
1.6	+++	+++	+++	+++
1.7	+++	+++	+++	+++
1.8	+++	+++	+++	+++
1.9	+++	+++	+++	+++
1.10—1.14				
1.15	++	++	++	++
1.16	++	++	++	++
1.17	++	++	++	++
1.18	++	++	++	++
1.19—1.22				
1.22а	++	++	++	++
1.23—1.25				
1.25а	++	++	++	++
1.26	++	++	++	++
1.28	++	++	++	++
1.29	++	++	++	++
1.30	++	++	++	++
1.31	++	++	++	++
1.32	++	++	++	++

### *Продолжение табл. 2*

Применяемость по полигидам однородной продукции

*Продолжение табл. 2*

Применяемость по подгруппам однородной продукции

Номер показателя по табл. 1	Дифрактометры общего назначения	Дифрактометры специализированные			
		Аппараты рентгеновские для структурного анализа с фотопрепаратором		Аппараты рентгеновские для исследований реальной структуры кристаллов на основе детекторов телевизионного типа	
		для определения макро-напряжений	для исследования в особых условиях	с отяжкой рентгеновской трубкой	с вращающимся анодом
7.1—7.3	+	+	+	+	+
8.1—8.2	+++	+++	+++	+++	+++
9.1—9.2	+	+	+	+	+
10.1	+++	+++	+++	+++	+++
11.1—11.5	+++	+++	+++	+++	+++

Таблица 3

Номер показателя по табл. 1	Применяемость по подгруппам однородной продукции			
	Спектрометры кристалл-дифракционные		Спектрометры без дифракционные с полупроводниковым детектором	Анализаторы рентгеновские
	многоканальные	сканирующие		
1.1	—	—	—	—
1.2	+	—	+	+
1.3—1.9	—	—	—	—
1.10	+	—	—	—
1.11	+	—	—	—
1.12	+	—	—	—
1.13	+	—	—	—
1.14	—	—	—	—
1.15—1.26	—	—	—	—
1.28	—	—	—	—
1.29—1.30	—	—	—	—
1.31	—	—	—	—
1.32—1.33	—	—	—	—
1.34	—	—	—	—
1.35	—	—	—	—
1.36	—	—	—	—
1.37	—	—	—	—
1.38—1.42	—	—	—	—
1.43	—	—	—	—
1.45—1.46	—	—	—	—
1.47—1.48	—	—	—	—
1.49	—	—	—	—
1.50.1—1.50.3	—	—	—	—
2.1.1	—	—	—	—
2.1.2	—	—	—	—
2.2.1	—	—	—	—
2.2.2	—	—	—	—
2.3.1	—	—	—	—
3.1—3.2	—	—	—	—
4.1—4.11	—	—	—	—
5.1—5.4	—	—	—	—
6.1—6.2	—	—	—	—
7.1—7.3	—	—	—	—
8.1—8.2	—	—	—	—
9.1—9.2	—	—	—	—
10.1	—	—	—	—
11.1—11.5	—	—	—	—

Таблица 4

Номер показателя по табл. 1	Применяемость по подгруппам однородной продукции		
	Микроскопы рентгеновские	Аппараты рентго- люминесцентные	Микроанализаторы рентгеновские
1.1—1.7	—	—	—
1.8	+	—	—
1.9	—	—	—
1.10	—	—	—
1.11	—	—	—
1.12	—	—	—
1.13	—	—	—
1.14—1.16	—	—	—
1.17	—	—	—
1.18	—	—	—
1.19	—	—	—
1.20	—	—	—
1.21	—	—	—
1.22—1.22а	—	—	—
1.23	—	—	—
1.24	—	—	—
1.25—1.25а	—	—	—
1.26	—	—	—
1.28—1.30	—	—	—
1.31	—	—	—
1.32—1.34	—	—	—
1.35	—	—	—
1.36—1.38	—	—	—
1.39	—	—	—
1.40—1.41	—	—	—
1.42	—	—	—
1.43	—	—	—
1.45	—	—	—
1.46	—	—	—
1.47	—	—	—
1.48	—	—	—
1.49	—	—	—
1.50.1—1.50.3	—	—	—
2.1.1	—	—	—
2.1.2	—	—	—
2.2.1	—	—	—
2.2.2	—	—	—
2.3.1	—	—	—
3.1—3.2	—	—	—
4.1—4.11	—	—	—
5.1—5.4	—	—	—
6.1—6.2	—	—	—
7.1—7.3	—	—	—
8.1—8.2	—	—	—
9.1—9.2	—	—	—
10.1	—	—	—
11.1—11.5	—	—	—

Таблица 5

Номер показателя по табл. 1	Применяемость по подгруппам однородной продукции		
	Приборы рентгенофизические		
	спектрометры рент- генэлектронные	спектрометры оже- электронные	аппараты для исследова- ния тонкой структуры рентгеновских спектров
1:1—1.12	—	—	—
1.13	+	±	±
1.14	+	+	±
1.15—1.17	—	—	—
1.18	—	+	—
1.19—1.21	—	—	—
1.22	—	—	—
1.22a	—	—	—
1.23—1.24	—	—	—
1.25	—	—	—
1.25a	—	—	—
1.26—1.32	—	—	—
1.33	—	—	—
1.34—1.35	±	±	±
1.36	+	±	±
1.37—1.45	—	—	—
1.46	—	—	—
1.47	—	—	—
1.48	—	—	—
1.49	—	—	—
1.50.1—1.50.3	—	—	—
2.1.1	—	—	—
2.1.2	—	—	—
2.2.1	—	—	—
2.2.2	—	—	—
2.3.1	—	—	—
3.1—3.2	—	—	—
4.1—4.11	—	—	—
5.1—5.4	—	—	—
6.1—6.2	—	—	—
7.1—7.3	—	—	—
8.1—8.2	—	—	—
9.1—9.2	—	—	—
10.1	—	—	—
11.1—11.5	—	—	—

Таблица 6

Номер по- казателя по табл. 1	Область применения показателя				
	ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ	Стандарты (кроме ГОСТ ОТТ)	ТЗ на ОКР	ТУ	КУ
1.1	+	+	+	+	±
1.2	++	+	+	++	±
1.3	++	+	+	++	±
1.4	++	+	+	++	±
1.5	++	+	+	++	±
1.6	++	+	+	++	±
1.7	++	+	+	++	±
1.8	++	+	+	++	±
1.9	++	+	+	++	±
1.10	++	+	+	++	±
1.11	++	+	+	++	±
1.12	++	+	+	++	±
1.13	++	+	+	++	±
1.14	++	+	+	++	±
1.15	++	+	+	++	±
1.16	++	+	+	++	±
1.17	++	+	+	++	±
1.18	++	+	+	++	±
1.19	++	+	+	++	±
1.20	++	+	+	++	±
1.21	++	+	+	++	±
1.22	++	+	+	++	±
1.22a	++	+	+	++	±
1.23	++	+	+	++	±
1.24	++	+	+	++	±
1.25	++	+	+	++	±
1.25a	++	+	+	++	±
1.26	++	+	+	++	±
1.28	++	+	+	++	±
1.29	++	+	+	++	±
1.30	++	+	+	++	±
1.31	++	+	+	++	±
1.32	++	+	+	++	±
1.33	++	+	+	++	±
1.34	++	+	+	++	±
1.35	++	+	+	++	±
1.36	++	+	+	++	±
1.37	++	+	+	++	±
1.38	++	+	+	++	±
1.39	++	+	+	++	±
1.40	++	+	+	++	±
1.41	++	+	+	++	±
1.42	++	+	+	++	±
1.43	++	+	+	++	±
1.45	++	+	+	++	±
1.46	++	+	+	++	±
1.47	++	+	+	++	±

## Продолжение табл. 6

Номер по- казателя по табл. 1	Область применения показателя				
	ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ	Стандарты (кроме ГОСТ ОТТ)	ТЗ на ОКР	ТУ	КУ
1.48	—	—	±	±	±
1.49	—	—	+	+	+
1.50.1—	—	+	+	+	+
1.50.3	—	—	—	—	—
2.1.1	+	+	+	+	+
2.1.2	+	+	+	+	+
2.2.1	+	+	+	+	+
2.2.2	±	+	±	±	±
2.3.1	±	±	±	±	±
3.1—3.2	+	±	+	+	+
4.1—4.11	—	—	+	—	±
5.1—5.4	—	—	+	—	—
6.1—6.2	—	—	+	—	+
7.1—7.3	—	—	+	+	+
8.1—8.2	—	—	—	—	+
9.1—9.2	—	—	—	—	+
10.1	—	—	±	±	±
11.1—11.5	—	—	—	—	—

П р и м е ч а н и е к т а б л . 2—6. Знак «+» означает применяемость, знак «—» — неприменимость, знак «±» — ограниченную применяемость (в технически обоснованных случаях) соответствующих показателей качества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Справочное

### АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	Номер пока- зателя по табл. 1
Возможность восприятия и переработки информации	4.9
<b>Воспроизводимость положения линии спектра</b>	1.48
Время восстановления работоспособного состояния сред- нее	2.3.1
<b>Время одного цикла</b>	1.12
Время срабатывания защиты	11.1
Выразительность информационная	5.1
<b>Выход материала на отсечку</b>	1.21
<b>Давление в рабочем объеме наименьшее (пределное ос- таточное)</b>	1.33
Диапазон анализируемых элементов	1.10
Диапазон исследуемого излучения	1.22
Диапазон поворота по углу $\alpha$	1.4
Диапазон регулировки высокого напряжения и анодного тока	1.34
<b>Диапазон рабочих углов</b>	1.5
Диапазон угловых перемещений рентгеновской трубы	1.30
Диапазон ускоряющих напряжений	1.23
<b>Диапазон углового перемещения блока детектирования</b>	1.1
Значение относительной влажности при температуре вер- хнее	7.2
<b>Извлечение минерала</b>	1.19
Интервал рабочих температур, при которых исследуется образец	1.7
Класс крупности обрабатываемого материала	1.35
<b>Количество одновременно анализируемых элементов мак- симальное</b>	1.11
<b>Контрастность</b>	1.36
Коэффициент повторяемости	8.2
Коэффициент применяемости	8.1
<b>Масса</b>	3.1
<b>Мощность потребляемая</b>	3.2
<b>Мощность рентгеновской трубы номинальная</b>	1.8
Мощность экспозиционной дозы рентгеновского излуче- ния	10.1
<b>Нагрузка на действительное фокусное пятно рентгенов- ской трубы удельная</b>	1.38
Наличие аварийных сигнализаций, световой индикации	11.5
<b>Наличие автоматизации управления и обработки данных</b>	1.46
Наличие блокирующих устройств	11.4
Наличие сканирующего канала	1.43
Наработка на отказ средняя	2.1.1
Наработка безотказная установленная	2.1.2
Нестабильность анодного напряжения и тока	1.41
Оснащенность дополнительными устройствами (например, наличие приставок)	1.47
<b>Отношение сигнал/шум</b>	1.25

<b>Отклонение блока детектирования от заданного угла поворота допускаемое</b>	1.3
<b>Отклонение от среднего значения измеряемых деформаций среднее квадратическое</b>	1.22а
<b>Осциллирование блока детектирования сцинтилляционного</b>	
Параметры питающей сети	1.40
Площадь входного окна детектора рабочая	1.50.1
Погрешность основная аппаратурная	1.26
Погрешность регулирования заданной температуры	1.2
Погрешность угловой установки кристалла	1.25а
Показатели безотказности	1.15
Показатели долговечности	2.1
Показатель патентной защиты	2.2
Показатель патентной чистоты	9.1
Показатель ремонтопригодности	9.2
Показатель уровня вибрации	2.3
Показатель уровня освещенности	4.4
Показатель уровня температуры, влажности	4.2
Показатели уровня шума	4.3
<b>Предел обнаружения</b>	4.1
Прочность изоляции электрическая	1.37
<b>Производительность на классе крупности</b>	11.2
Размеры габаритные (или площадь установочная)	1.20
Размеры исследуемого образца допускаемые	1.49
Размеры экрана для визуального наблюдения	1.31
<b>Разрешение</b>	1.42
<b>Разрешение линейное</b>	1.16
<b>Разрешение спектральное (волновое, энергетическое)</b>	1.18
Рациональность формы	1.14
Себестоимость изделия технологическая	5.2
<b>Скорость счета на линии на контрольном образце</b>	6.2
<b>Скорость угловых перемещений блока детектирования установочная</b>	1.13
Совершенство производственного исполнения (товарный вид)	1.29
Сопротивление изоляции электрическое	5.4
Соответствие изделия силовым, энергетическим возможностям человека	11.3
Соответствие изделия слуховым и зрительным возможностям человека	4.6
Соответствие изделия закрепленным и вновь формируемым навыкам человека	4.7
Соответствие изделия размерам тела человека и его частей	4.8
Соответствие изделия форме тела человека и его отдельных частей	4.10
Соответствие современным эстетическим представлениям	4.11
Среда рабочая	5.1.1
Срок службы установленный	1.32
<b>Срок службы полный средний</b>	2.2.2
Сходимость показаний аппарата	2.2.1
Температура транспортирования	1.6
Трудоемкость изготовления изделия	7.1
Тряска при частоте ударов в минуту транспортная	6.1
<b>Увеличение</b>	7.3
<b>Увеличение в растровом режиме наименьшее</b>	1.17
	1.24

<b>Установка кристалла угловая</b>	1.9
<b>Управление сменой образцов автоматическое</b>	1.45
<b>Уровень радиопомех</b>	4.5
<b>Уровень композиционного решения</b>	5.3.1
<b>Условия эксплуатации</b>	1.50
<b>Устойчивость к климатическим воздействиям</b>	1.50.2
<b>Устойчивость к механическим воздействиям</b>	1.50.3
<b>Функциональность</b>	5.2.1
<b>Целостность композиции</b>	5.3
<b>Чувствительность контрастная</b>	1.39
<b>Шаг сканирования минимальный</b>	1.28

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Наименование показателя качества	Номер показателя по табл. 1	Пояснение
Выход материала на отсечку	1.21	Масса материала, поступающего в концентрат при однократном (10-кратном) срабатывании исполнительного устройства
Диапазон рабочих углов	1.5	Диапазон углов, в котором может быть зарегистрировано рентгеновское излучение, рассеянное или дифрагированное исследуемым образом
Допускаемое отклонение блока детектирования от заданного угла поворота	1.3	Отклонение действительного углового положения блока детектора, установленного системой управления аппарата, от заданного углового положения
Извлечение минерала	1.19	Отношение извлеченной массы минерала к его массе в исходном материале
Контрастная чувствительность	1.39	Отношение минимального наблюдаемого изменения толщины к толщине контрольного образца материала
Линейное разрешение	1.18	Минимальный линейный размер элемента контрольного образца, различимый по изображению объекта или при помощи средств регистрации
Отношение сигнал/шум	1.25	Отношение амплитуды ожидаемого элемента к междуликовому значению шума при заданных значениях энергии и тока первичного пучка электронов и постоянной времени тракта регистрации
Предел обнаружения	1.37	Минимально обнаружимое количество или концентрация элемента (вещества) в искусственном (контрольном) образце
Увеличение	1.17	Отношение линейного размера элемента изображения контрольного образца к размеру соответствующего элемента образца
Установочная скорость угловых перемещений блока детектирования	1.29	Транспортная скорость углового перемещения блока детектирования
Сходимость показаний аппарата	1.6	Качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
Справочное

**ПРИМЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ**

1. Показатели стандартизации и унификации

Для оценки уровня унификации изделий приборостроения устанавливают следующие показатели:

коэффициент применяемости по типоразмерам  $K_{\text{пр}}^{\text{T}}$ ;

коэффициент применяемости по себестоимости  $K_{\text{пр}}^{\text{c}}$ ;

коэффициент повторяемости  $K_{\text{n}}$ .

1.1. Коэффициент применяемости по типоразмерам  $K_{\text{пр}}^{\text{T}}$  (п. 8.1 табл. 1) в процентах определяют по формуле

$$K_{\text{пр}}^{\text{T}} = \frac{n - n_0}{n} \cdot 100, \quad (1)$$

где  $n$  — общее количество типоразмеров составных частей изделия;

$n_0$  — количество типоразмеров оригинальных составных частей изделия.

Перечень типоразмеров соответствует спецификации сборочных единиц.

1.2. Коэффициент применяемости по себестоимости  $K_{\text{пр}}^{\text{c}}$  (п. 8.1 табл. 1) в процентах определяют по формуле

$$K_{\text{пр}}^{\text{c}} = \frac{C - C_0}{C} \cdot 100, \quad (2)$$

где  $C$  — стоимость всех составных частей изделия, руб;

$C_0$  — стоимость оригинальных составных частей изделия, руб.

1.3. Коэффициент повторяемости составных частей  $K_{\text{n}}$  (п. 8.2 табл. 1) в процентах определяют по формуле

$$K_{\text{n}} = \frac{N}{n} \cdot 100, \quad (3)$$

где  $N$  — общее количество составных частей изделия;

$n$  — общее количество типоразмеров составных частей изделия.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления**

### ИСПОЛНИТЕЛИ

И. А. Брытов, д-р физ.-мат. наук; В. А. Карпушенко; Р. И. Плотников, канд. техн. наук (руководитель темы); В. К. Муха

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 сентября 1985 г. № 3195**

**3. Срок проверки — 1990 г.**

**4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

### 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 27.002—83	Пп. 2.1.1, 2.2.1 табл. 1
ГОСТ 27.003—83	Пп. 2.1.2, 2.2.2, 2.3.1 табл. 1
ГОСТ 16865—79	Пп. 1.2, 1.36, 1.37 табл. 1
ГОСТ 20337—74	П. 1.38 табл. 1

**6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1988 г.) с Изменением № 1, утвержденным в августе 1987 г. (ИУС 12—87)**

Редактор *В. С. Бабкина*  
Технический редактор *М. М. Герасименко*  
Корректор *С. И. Ковалева*

Сдано в наб. 15.11.88 Подп. в печ. 23.01.89 1,75 усл. п. л. 1,75 усл. кр.-отт. 1,76 уч.-изд. л.  
Тираж 4000 Цена 10 коп.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., д. 3.  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даляус и Гирено, 39. Зак. 3027.

Цена 10 коп.

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		международное	русское

## ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Длина	метр	m	м
Масса	килограмм	kg	кг
Время	секунда	s	с
Сила электрического тока	ампер	A	А
Термодинамическая температура	kelвин	K	К
Количество вещества	моль	mol	моль
Сила света	кандела	cd	кд

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Плоский угол	радиан	rad	рад
Телесный угол	стерадиан	sr	ср

## ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица			Выражение через основные и дополнительные единицы СИ	
	Наименование	Обозначение			
		междуна- родное	русско- е		
Частота	герц	Hz	Гц	$\text{с}^{-1}$	
Сила	ニュто́н	N	Н	$\text{м}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$	
Давление	паскаль	Pa	Па	$\text{м}^{-1}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$	
Энергия	дюйль	J	Дж	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$	
Мощность	ватт	W	Вт	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}$	
Количество электричества	кулон	C	Кл	с·А	
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-1}$	
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^4\cdot\text{А}^2$	
Электрическое сопротивление	ом	Ω	Ом	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-2}$	
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^4\cdot\text{А}^2$	
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$	
Магнитная индукция	tesла	T	Тл	$\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$	
Индуктивность	генри	H	Гн	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-2}$	
Световой поток	люмен	lm	лм	кд · ср	
Освещенность	люкс	lx	лк	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кд}\cdot\text{ср}$	
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	$\text{с}^{-1}$	
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грэй	Gy	Гр	$\text{м}^2\cdot\text{с}^{-2}$	
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$\text{м}^2\cdot\text{с}^{-2}$	